臺灣新竹地方法院刑事裁定

109年度聲字第1446號

聲　請　人　旺矽科技股份有限公司
法定代理人　葛長林
告訴代理人　陳婕妤律師
　　練家雄律師
相　對　人
即　被　告　李忠哲
　　陳世欣
　　王裕衡
　　吳承恩
相對人　即
上　四　人
選任辯護人　鄭勵堅律師
　　李佳玲律師
相　對　人　王詩雅
相　對　人
即　被　告　穎崴科技股份有限公司
兼　法　定
代　理　人　王嘉煌

上列聲請人因本院109年度智訴字第5號、第6 號違反營業秘密法案件，聲請對相對人核發秘密保持命令，本院裁定如下：

主　文

相對人李忠哲、陳世欣、王裕衡、吳承恩、穎崴科技股份有限公司及其法定代理人王嘉煌就本院一〇九年度智訴字第五號、第六號案件，如附表一所示之訴訟資料關於聲請人所有之營業秘密，不得為實施本院一〇九年度智訴字第五號、第六號刑事訴訟以外之目的而使用，或對未受秘密保持命令之人開示，且不得抄錄、影印、攝影或以任何其他方式留存附表一所示之訴訟資料。

相對人鄭勵堅律師、李佳玲律師及王詩雅就本院一〇九年度智訴字第五號、第六號案件，如附表一所示之訴訟資料關於聲請人所有之營業秘密，不得為實施本院一〇九年度智訴字第五號、第六

號刑事訴訟以外之目的而使用，或對未受秘密保持命令之人開示。

限制相對人李忠哲、陳世欣、王裕衡、吳承恩、鄭勵堅律師、李佳玲律師、王詩雅、穎崴科技股份有限公司及其法定代理人王嘉煌檢閱、抄錄或攝影或以任何其他方式留存附表二所示之訴訟資料。

相對人穎崴科技股份有限公司及其法定代理人王嘉煌就本院一〇九年度智訴字第五號、第六號案件，如附表三所示之訴訟資料關於聲請人所有之營業秘密，不得為實施本院一〇九年度智訴字第五號、第六號刑事訴訟以外之目的而使用，或對未受秘密保持命令之人開示，且不得抄錄、影印、攝影或以任何其他方式留存附表三所示之訴訟資料。

限制相對人穎崴科技股份有限公司及其法定代理人王嘉煌檢閱、抄錄或攝影或以任何其他方式留存附表四所示之訴訟資料。

相對人陳世欣、王裕衡、吳承恩、李忠哲、鄭勵堅律師、李佳玲律師、王詩雅、穎崴科技股份有限公司及其法定代理人王嘉煌之住所、居所或營業所有遷移時，應向法院陳明。

理　由

一、聲請意旨略以：

㈠相對人即被告李忠哲、陳世欣、王裕衡、吳承恩及渠等辯護人鄭勵堅律師、李佳玲律師及律師助理王詩雅等人分別經本院109年度聲字第915號及第1320號裁定核發秘密保持命令暨限制閱覽訴訟資料在案，惟臺灣新竹地方檢察署檢察官業以109年度偵續字第70號追加起訴被告穎崴科技股份有限公司（下稱穎崴公司），由本院109年度智訴字第6號審理中，該案之原始卷證資料已移送本院，爰對上開相對人追加聲請臺灣新竹地方檢察署108年度偵字第5234號卷三第32頁所附光碟內之聲請人之營業秘密，核發秘密保持命令及限制閱覽。

㈡而上開光碟證物內容為告證99至告證134 之電磁紀錄，其中附表一所示均為聲請人旺矽科技股份有限公司（下稱旺矽公司）所有「垂直式探針卡相關產品」之設計準則、製程方法

、製程環節、設備規格、產品開發專案計劃資訊、市場分析資訊等營業秘密。且聲請人已對前揭營業秘密採取合理保密措施，聲請人自得依智慧財產案件審理法第30條準用第11條第1項之規定，對相對人李忠哲、陳世欣、吳承恩、王裕衡、鄭勵堅律師、李佳玲律師、王詩雅聲請核發秘密保持命令。又相對人李忠哲、陳世欣、吳承恩及王裕衡現於聲請人競爭對手即被告穎崴公司任職，為免其等抄錄、影印、攝影或以任何其他方式拷貝上開聲請人營業秘密，致聲請人營業秘密外流，造成聲請人損害，爰依智慧財產案件審理法第24條聲請限制其等閱覽上開訴訟資料。

㈢另就附表二所示均為聲請人提出舉證本案未起訴之被告涉犯營業秘密法等罪嫌之相關事證，而與本案起訴被告李忠哲等人之犯行無涉，應限制相對人李忠哲、陳世欣、吳承恩、王裕衡、鄭勵堅律師、李佳玲律師、王詩雅檢閱、抄錄、攝影或以任何其他方式留存如附表二所示之訴訟資料，爰依智慧財產案件審理法第24條聲請限制其等閱覽上開訴訟資料。

㈣又相對人即被告穎崴公司經臺灣新竹地方檢察署檢察官以109年度偵續字第70號追加起訴被告穎崴公司，由本院109年度智訴字第6 號審理中，如附表一、附表二、附表三、附表四所示之資料，均為聲請人所有「垂直式探針卡相關產品」之設計準則、製程方法、製程環節、設備規格、產品開發專案計劃資訊、市場分析資訊等營業秘密，非一般及該類競爭廠商、人員所知悉，足使聲請人在製造、銷售保持競爭優勢，具有實際或潛在之經濟價值，且聲請人已採取適當之保密措施，屬聲請人之營業秘密，有限制相對人即本案被告穎崴公司及其法定代理人王嘉煌開示或使用之必要，爰聲請核發秘密保持命令，禁止相對人穎崴公司及法定代理人王嘉煌為實施本院109年度智訴字第6號刑事訴訟以外之目的而使用，或對未受秘密保持命令之人為開示，且不得抄錄、影印及攝影或以任何其他方式留存附表一、附表三所示之訴訟資料；另附表二、四所示之資料，係聲請人所提出舉證本案未起訴之

被告涉犯營業秘密法之相關事證，而與本案起訴被告穎崴公司之犯行無涉，應禁止相對人穎崴公司及法定代理人王嘉煌檢閱、抄錄、攝影或以任何其他方式留存如附表四所示之訴訟資料，爰依智慧財產案件審理法第24條規定，聲請限制相對人穎崴公司及法定代理人王嘉煌閱覽上開附表二、四所示之訴訟資料等語。

二、按訴訟資料涉及營業秘密者，法院得依聲請不公開審判；亦得依聲請或依職權限制卷宗或證物之檢閱、抄錄或攝影，智慧財產案件審理法第24條定有明文。又當事人或第三人就其持有之營業秘密，經釋明符合下列情形者，法院得依該當事人或第三人之聲請，對他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人發秘密保持命令：一、當事人書狀之內容，記載當事人或第三人之營業秘密，或已調查或應調查之證據，涉及當事人或第三人之營業秘密。二、為避免因前款之營業秘密經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用，有妨害該當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之虞，致有限制其開示或使用之必要；受秘密保持命令之人，就該營業秘密，不得為實施該訴訟以外之目的而使用之，或對未受秘密保持命令之人開示，為智慧財產案件審理法第11條第1項、第3項所明定，並依同法第30條規定，於審理第23條（智慧財產刑事）案件或其附帶民事訴訟時，準用之。又關於應受秘密保持命令之人，以得因本案接觸該營業秘密之人為限。智慧財產案件審理細則第21條第1項前段亦有明文。

三、經查：

㈠聲請人旺矽公司前曾就如附表三所示之證據資料關於屬於聲請人旺矽公司所有「垂直式探針卡相關產品」之生產技術、製程方法、製程環節、設備規格、產品照片、研發成本與銷售價格資訊、產品開發專案計畫資訊、市場分析資訊等營業秘密，暨聲請人旺矽公司對於其所有之營業秘密、技術所採取之各項保密措施，聲請對本案訴訟相關相對人（包括被告李忠哲等4人及其等選任辯護人及律師助理）核發秘密保持

命令，經本院審理後，以109年度聲字第915號、第1320號裁定准許等情，業據本院調取本院109年度聲字第915號、第1320號卷宗核閱無訛。而今本案臺灣新竹地方檢察署檢察官另以109年度偵續字第70號追加起訴被告穎崴公司，並由本院109年度智訴字第6號受理中，該案之原始卷證資料已移送本院，而其中臺灣新竹地方檢察署108年度偵字第5234號卷三第32頁確附有一片光碟，經本院檢視該光碟，其內確有「告證99」至「告證134」之電磁紀錄，有該光碟讀取畫面截圖在卷可憑，如附表一所示之電磁紀錄，核屬聲請人之營業秘密，聲請人聲請對相對人李忠哲、陳世欣、王裕衡、吳承恩、鄭勵堅律師、李佳玲律師、王詩雅、穎崴公司及其法定代理人王嘉煌核發秘密保持命令，為兼顧相對人等防禦權之行使，俾能充分提出答辯，認本件秘密保持命令之聲請經核並無不合，應予准許。

㈡又如附表二所示之資料亦為聲請人旺矽公司所有之營業秘密，聲請人前經表示皆非在本案起訴範圍，現階段尚難認與本案刑事訴訟有何關連性或與何待證事項相關，本院審酌前情，如附表二所示訴訟資料應限制相對人李忠哲、陳世欣、王裕衡、吳承恩、鄭勵堅律師、李佳玲律師、王詩雅、穎崴公司及其法定代理人王嘉煌檢閱、抄錄或攝影或以任何其他方式留存附表二所示之訴訟資料。至本案審理程序進行中，倘因審理進度、調查證據範圍而有開示之必要者，本院當另行就此部分再為適當處理。

㈢再者本案109年度智訴字第6號案所移送之卷證，經核與本院109年度智訴字第5號案之卷證影本相符，聲請人就附表三所示之資料，聲請對相對人即追加被告穎崴公司及其法定代理人王嘉煌核發秘密保持命令，本案審酌附表三所示資料涉及聲請人之營業秘密，該營業秘密如經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用，有妨害當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之虞，而有限制其開示或使用之必要，此據聲請人提出書狀釋明，本院審酌其內容非一般涉及該類資訊之人員

所知，確具有經濟價值，聲請人亦設有相關保密措施，於現階段可認確屬聲請人之營業秘密，已認定如前，為兼顧相對人穎崴公司及其法定代理人王嘉煌防禦權之行使，俾能充分提出答辯，認本件秘密保持命令之聲請經核並無不合，應予准許。

㈣又如附表四所示之資料亦為聲請人旺矽公司所有之營業秘密，聲請人前經表示皆非在本案起訴範圍，現階段尚難認與本案刑事訴訟有何關連性或與何待證事項相關，本院審酌前情，如附表四所示訴訟資料應限制相對人被告穎崴公司及其法定代理人王嘉煌檢閱、抄錄或攝影或以任何其他方式留存附表四所示之訴訟資料，至本案審理程序進行中，倘因審理進度、調查證據範圍而有開示之必要者，本院當另行就此部分再為適當處理。

㈤再按受秘密保持命令之人，其住所或居所有遷移時，應向法院陳明，智慧財產案件審理細則第27條第3 項定有明文，因此受秘密保持命令之相對人李忠哲、陳世欣、王裕衡、吳承恩、鄭勵堅律師、李佳玲律師、王詩雅、穎崴公司及其法定代理人王嘉煌，於住所、居所或營業所遷移時，應向本院陳明，併此敘明。

四、依智慧財產案件審理法第24條、第30條、第11條第1 項、第13條第1項，智慧財產案件審理細則第21條、第27條第3項，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　11　　月　　25　　日

刑事第七庭　審判長　法　官　陳麗芬

法　官　郭哲宏

法　官　華澹寧

以上正本證明與原本無異。

不得抗告。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　11　　月　　25　　日

書記官　吳羽君

附表一（即聲請狀附表三）：

編號	分類	項目	營業秘密名稱	108 年度偵字第5234號卷三第32頁所附光碟內之電磁紀錄
1	垂直式探針卡設計準則	1-1	Probe card機械設計	【告證99】之電磁紀錄
		1-2	PH設計規範	【告證100】之電磁紀錄
		1-3	Film設計規範	【告證101】之電磁紀錄
		1-4	VPC Check List設計查檢表	【告證102】之電磁紀錄
		1-5	探針卡關鍵元件之迴焊尺寸	【告證104】之電磁紀錄
2	垂直式探針卡生產製作資料	2-1	探針頭（PH）仕樣書（針對輝達公司，英文名稱為NVIDIA Coporation，以下稱輝達公司）製造序號： MVP161482H-0001 MVP162354H-0001 MVP162355H-0001	【告證105-1】 【告證105-2】 【告證105-3】 之電磁紀錄
		2-2	空間轉換器（ST）仕樣書（針對輝達公司）製造序號： MVP162353S-0001	【告證106】之電磁紀錄
3	垂直式探針	3-1	PCB檢驗作業指導書	【告證107】

（續上頁）

	卡檢驗與製作作業指導書資訊			之電磁紀錄
		3-2	微孔檢驗作業指導書	【告證108】之電磁紀錄
		3-3	Substrate 外觀限度樣本	【告證109】之電磁紀錄
		3-4	VPC Substrate 檢驗作業指導書	【告證110】之電磁紀錄
		3-5	PCB 外觀判定標準一覽表	【告證111】之電磁紀錄
		3-6	客戶支給pcb 檢驗作業指導書	【告證112】之電磁紀錄
		3-7	PROBE CARD加工件檢驗作業指導書	【告證113】之電磁紀錄
		3-8	VPC 加工零件檢驗作業指導書	【告證114】之電磁紀錄
		3-9	Cobra 針檢驗作業指導書	【告證115】之電磁紀錄
		3-10	VPC Substrate 供應商檢驗規範	【告證116】之電磁紀錄
		3-11	進料檢驗管理辦法	【告證117】之電磁紀錄
		3-12	包材檢驗規範	【告證118】之電磁紀錄

（續上頁）

		3-13	進料PCB 檢驗單	【告證119】之電磁紀錄
4	垂直式探針卡設計資訊	4-1	輝達公司探針卡之3D及2D 設計圖	【告證123】之電磁紀錄
		4-2	垂直式探針卡設計資訊Pin Assignment（PA檔）	【告證126】之電磁紀錄
5	探針特性檢驗機台(Probe Analysis System，簡稱:PAS)	5-1	探針特性檢驗機台設計圖	【告證128】之電磁紀錄
6	垂直式探針卡關鍵元件	6-1	垂直式探針設計圖	【告證129】之電磁紀錄
		6-2	Film設計圖	【告證123】之電磁紀錄
7	垂直式探針卡檢驗工具	7-1	CAM量測治具設計圖	【告證130】之電磁紀錄
8	產品開發專案計畫資訊	8-1	RP7 新產品開發專案計畫	【告證131】之電磁紀錄
		8-2	MPPT新產品開發專案計畫	【告證132】之電磁紀錄
9	垂直式探針		技術路徑(TRM)分析	【告證134】

（續上頁）

	卡市場分析資訊			之電磁紀錄

附表二（即聲請狀附表四）：

編號	分類	項目	營業秘密名稱	108 年度偵字第5234號卷三第32頁所附光碟內之電磁紀錄
1	製作作業指導書資訊	1-1	VPC PH整卡Run In作業指導書	【告證120】之電磁紀錄
		1-2	VPC PH換針作業指導書（半固定Film)	【告證121】之電磁紀錄
		1-3	VPC PH磨針(精修)作業指導書(Point)	【告證122】之電磁紀錄
2	龍門式顯微鏡設計資訊	2-1	設計圖檔	【告證127】之電磁紀錄
		2-2	BOM表	【告證127】之電磁紀錄
3	產品開發專案計畫資訊	3-1	3DS100II開發專案	【告證133】之電磁紀錄
4	垂直式探針卡設計準則		ME-Design-Flow	【告證103】之電磁紀錄

附表三（即聲請㈡狀附表五）：

編號	分類	項目	營業秘密名稱	所在卷頁
1	垂直式探針卡設計準則	1-1	Probe card機械設計	見108年度偵字第5234號卷三第81頁至第97頁、108偵11670卷一第54頁
		1-2	PH設計規範	見108年度偵字第5234 號卷一第103頁至第104頁正面、卷二第291頁、卷三第98頁至第103頁、107年度他字第388號卷四第292頁反面至第293頁正面、卷五第30至32頁、108偵11670卷一第54頁
		1-3	Film設計規範	見108 偵5234卷一第104反面、卷二第292頁、卷三第104 頁至第113頁、109偵611卷一第111頁、107他388號卷四第291頁反面至第292 頁正面、卷五第27至第29頁、
		1-4	VPC Check List設計查檢表	見108偵5234號卷三第114頁至第122 頁
		1-5	探針卡關鍵元件之迴焊尺寸	見108 偵5234卷三第128 頁至第134 頁、108偵11670卷一第55頁反面）

（續上頁）

2	垂直式探針卡生產製作資料	2-1	探針頭（PH）仕樣書（針對輝達公司，英文名為nVIDIDA）製造序號： MVP161482H-0001 MVP162354H-0001 MVP162355H-0001	見108偵5234 號卷三第135頁至第180頁108偵11670卷一第55頁）
		2-2	空間轉換器（ST）仕樣書（針對輝達公司）製造序號： MVP162353S-0001	見108偵11670卷一第55頁、108偵5234卷二第143頁
3	垂直式探針卡檢驗與製作作業指導書資訊	3-1	PCB檢驗作業指導書	見108偵5234卷三第181頁至第205頁、108偵5234卷二第303頁、108 偵11670 卷一第57頁
		3-2	微孔檢驗作業指導書	見108偵5234卷二第304頁、卷三第206頁至第237頁、108 偵11670 卷一第57頁
		3-3	Substrate 外觀限度樣本	見108偵5234卷二第305頁、卷三第238頁至第242頁、108偵11670卷一第57頁
		3-4	VPC Substrate 檢驗作業指導書	見108 偵5234卷一第146頁至第147頁反面、卷二第306 頁、卷三第243頁至第262頁、107他388號卷三第

（續上頁）

				159頁反面至第161頁、第163頁至第171頁反面、卷五第63至第66頁、108偵11670卷一第57頁、第76頁至第77頁
		3-5	PCB 外觀判定標準一覽表	見108偵11670卷一第57頁
		3-6	客戶支給pcb 檢驗作業指導書	見108偵11670卷一第57頁
		3-7	PROBE CARD加工件檢驗作業指導書	見108偵11670卷一第57頁
		3-8	VPC 加工零件檢驗作業指導書	見108偵11670卷一第57頁
		3-9	Cobra 針檢驗作業指導書	見108偵11670卷一第57頁
		3-10	VPC Substrate 供應商檢驗規範	見108偵11670卷一第57頁
		3-11	進料檢驗管理辦法	見108偵11670卷一第57頁
		3-12	包材檢驗規範	見108偵11670卷一第57頁
		3-13	進料PCB 檢驗單	見107他388號卷二第198頁正反面、卷二第199頁至第200頁反

（續上頁）

				面、108偵11670卷一第57頁
4	垂直式探針卡設計資訊	4-1	輝達公司探針卡之3D及2D 設計圖	見108偵5234卷一第102頁正反面、第105頁正反面、卷三第292頁至第294頁、107他388號卷四第126頁至第128頁、第293頁反面至第294頁反面、卷五第33頁至第34頁、108偵11670卷一第第55頁
		4-2	垂直式探針卡設計資訊Pin Assignment（PA檔）	見108偵5234卷三第318頁至第329頁、108偵11670卷一第57頁至第58頁
5	探針特性檢驗機台(Probe Analysis System，簡稱:PAS)	5-1	探針特性檢驗機台設計圖	108年度偵字第5234號卷三第331頁、108偵11670卷一第54頁反面
		5-2	探針特性檢驗機台規格與功能說明	見108偵5234號卷二第293頁、109偵611號卷一第113頁、第117頁、108偵11670卷一第54頁反面
6	垂直式探針卡關鍵元件	6-1	垂直式探針設計圖	見108偵5234卷三第332頁至第336頁

（續上頁）

		6-2	探針卡結構改善模擬比較	見108偵5234卷三第32頁
		6-3	IP（Interposer）能力比較表	見107他388號卷二第148頁至第149頁反面
7	垂直式探針卡檢驗工具	7-1	CAM量測治具設計圖	見108 偵5234號卷二第118頁至第119頁、第249頁至251頁、卷三第337頁、108偵字11670 卷一第59頁、第79頁、卷二第24頁正面、第25頁正面
		7-2	磨針治具設計圖	見108 偵5234號卷二第126頁反面至第127頁反面、107他388號卷四第124 反面至第125 頁反面、卷五第12頁至第13頁
8	產品開發專案計畫資訊	8-1	RP7 新產品開發專案計畫	見108偵5234 卷一第56頁反面至第57頁反面、卷三第338 頁至第341 頁、107他388卷一第45-1頁正反面及第151頁至第154頁反面、卷四第15頁正反面、第24頁反面至第25頁反面及第35頁至第38頁、卷五第2頁至第4頁、108偵11670號卷一第60 頁反面至第61頁反面

（續上頁）

		8-2	MPPT新產品開發專案計畫	見108偵5234號卷一第58頁反面至第60頁正面、卷三第342 頁、第343頁至第356頁、107他388卷一第45-1頁正、反面及第151頁至第154頁反面、卷四第15頁正反面、第26至第27頁及第39頁、卷五第6頁至第9頁、108偵11670號卷一第62頁反面至第64頁正面
9	垂直式探針卡市場分析資訊		技術路徑(TRM)分析	見108偵5234卷三第362頁至第366頁
10	聲請人垂直式探針卡產品照片及示意圖等資訊		聲請人垂直式探針卡產品照片及示意圖等資訊（就李忠哲等四人重製部分）	見107他388卷一第27頁反面至第28頁、第167頁正反面、第171頁至第175頁、第176頁至第181頁、第187頁、卷二第238 頁至第239頁、108偵5234卷二第315頁至第316頁
11	聲請人營業秘密研發成本與銷售價格資訊	11-1	李忠哲重製營業秘密價值說明	見107他388卷一第33頁、第45頁及第161頁反面、卷四第14頁及第28頁反面、卷五第5頁、第10頁、108

（續上頁）

				偵11670 卷一第54頁正反面、第62頁正面、第64頁反面、第92頁反面
		11-2	陳世欣重製營業秘密價值說明	見107他388卷一第35頁、第53頁及第162頁反面至第163 頁、卷四第29頁反面至第30頁反面及第246 頁、第252頁、第295頁反面至第296 頁反面、108偵11670卷一第55頁至第56頁、第68頁反面、第73頁、第94頁正反面
		11-3	王裕衡重製營業秘密價值說明	見107他388卷一第40頁、第78頁、第165頁、卷三第147頁、卷四第34頁、108偵11670卷一第57頁至第58頁、第93頁正反面
		11-4	吳承恩重製營業秘密細項與價值說明	見107他388卷一第36頁及第60頁反面、卷四第31頁至第32頁正面、第89頁反面、第96頁、第129頁反面至第130頁反面、108偵11670卷一第59頁、第95頁

（續上頁）

12	刑事搜索、扣押之聲請人營業秘密	12-1	李忠哲重製之聲請人營業秘密	見108 偵5234卷二第138頁、第347頁、108偵11670卷一第54頁
		12-2	陳世欣重製之聲請人營業秘密	見108偵5234號卷一第107頁至第110頁反面、卷二第140頁至第149頁反面及第348頁、108偵11670卷一第55頁至第56頁
		12-3	王裕衡重製之聲請人營業秘密	見108偵5234號卷二第138頁反面至第139頁反面、第349 頁、108偵11670卷一第57頁至第58頁
		12-4	吳承恩重製之告證84聲請人營業秘密	見108 偵5234號卷二第118頁至第120頁反面、第150頁、第350頁、108偵11670卷一第59頁
13	聲請人垂直式控針卡廠內環境照片		聲請人垂直式探針卡廠環境照片	見107他388卷一第23頁反面至第26頁反面、109他611號卷一第136頁反面至第139頁反面
14	聲請人垂直式探針卡設計流程與時程		聲請人垂直式探針卡設計流程與時程	見107他388卷五第36頁、108偵5234號卷一第106頁

（續上頁）

15	研發成本與銷售資訊	15-1	輝達公司TU104 產品報價、訂單與營業損失資訊	見108偵5234卷二第328頁、109偵611號卷第68頁至第69頁、第78頁至第第81頁）
		15-2	92-108年研發費用及統計圖表	見108偵5234號卷二第332頁至333頁
16	聲請人設計、製造輝達公司產品之營業秘密		輝達公司產品共通使用之聲請人營業秘密	見108 偵5234卷二第296頁至300頁、卷三第35頁反面至53頁

附表四（即聲請書附表六）：

編號	分類	項目	營業秘密名稱	所在卷頁
1	製作作業指導書資訊	1-1	VPC PH整卡Run In作業指導書	見108偵5234卷三第263頁至第269頁
		1-2	VPC PH換針作業指導書（半固定Film)	見108偵5234卷三第270頁至第277頁
		1-3	VPC PH磨針(精修)作業指導書(Point)	見108偵5234卷三第278頁至第291頁
2	龍門式顯微鏡設計資訊	2-1	設計圖檔	見108 偵5234卷三第330頁、107 他388卷二第216頁至第222頁反面
		2-2	BOM表	見108 偵5234卷三第330頁、107他388 號卷二第216頁至第222頁反面

（續上頁）

		2-3	龍門式顯微鏡規格說明	見108偵5234卷二第295頁
3	產品開發專案計畫資訊	3-1	3DS100II開發專案	見108偵5234號卷三第357頁至第361頁、107他388卷三第75頁至第79頁反面
		3-2	聲請人80um探針開發專案資訊與研發經費	見108偵5234卷二第336頁
4	80um間距探針設計規範		80um間距探針設計規範	見108偵5234卷二第337頁至346頁
5	聲請人設計、製造輝達公司產品之營業秘密		輝達公司GA104產品營業秘密	108偵5234卷四第9頁至第11頁、第13頁至第26頁
6	聲請人垂直式探針卡產品照片及示意圖		聲請人垂直式探針卡產品照片及示意圖（郭嘉源、呂冠龍、張建銘、陳垿墅即陳俊男部分）	見107 他388 卷一第168頁至第170頁、第182頁正反面、第183頁反面至第185 頁正面、第186頁、108偵5234卷二第315頁至316頁
7	營業秘密細項與價值說明	7-1	郭嘉源營業秘密細項與價值說明	見107他388卷一第34頁及第46頁至第49頁反面、第162 頁、卷四第29頁、第182 頁至第187頁、第207頁

（續上頁）

				至第219頁、第246頁、卷五第18頁至第25頁、108偵5234卷一第220頁至第224頁
		7-2	陳垿望（陳俊男）營業秘密細項與價值說明	見107他388卷一第39頁、第73頁至第75頁、第164 頁反面、卷三第98頁至第99頁、第102頁至第105頁、卷四第33頁反面、卷五第56頁至第60頁、108 偵5234卷二第94頁至第98頁
		7-3	張建銘營業秘密細項與價值說明	見107他388號卷一第37頁、第67頁至第69頁、第163 頁反面、卷三第61頁正反面、第63頁、第71頁至第79頁反面、卷四第32頁反面、卷五第48頁至第55頁、108 偵字5234卷二第185頁至第188頁
		7-4	呂冠龍營業秘密細項與價值說明	見107他388號卷一第38頁、第70頁至第72頁反面、第164 頁、卷三第13頁反面、第16頁反面、第27頁至第30頁反面、第31頁反面、卷四第33頁正面、卷五第39頁至第

（續上頁）

				47頁、108 偵5234號卷二第69頁至73頁反面
8	聲請人易簡計畫		易簡計畫說明	108偵5234號卷二第213頁至第217頁反面
9	未經刑事起訴被告之相關訴訟資料		未經刑事起訴被告之相關書狀內容	見108偵5234卷二第177頁至第203頁、卷三第1頁至第35頁、109偵611卷第85頁至第117頁
10	垂直式探針卡設計準則		ME-Design-Flow	見108偵5234卷三第123頁至第127頁
11	PCI研發專案		PCI研發專案	見107他388卷三第32頁至第42頁反面